

RP



RP

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1170) został udzielony na rzecz:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa, Polska

PATENT

NR 245560

NA WYNAŁAZEK PT.

System detekcji bazujący na świetle wstecznie odbitym do ogniskowania wiązki w szczypcach optycznych oraz sposób zwiększenia precyzji pomiaru położenia obiektu wewnątrz szczypiec optycznych

*przedstawiony w opisie patentowym
włączonym do niniejszego dokumentu*

Patent trwa od dnia: **2021-07-08**

Warszawa, dnia 2024-09-03

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Patentowego

Bąkowska

Agnieszka Bąkowska
PODREFERENDARZ

RP

RP